

2020年CSNS反角白光中子源用户研讨会（第四届）

Tuesday, 11 August 2020

第二组：裂变截面和全截面测量 - 会议 ID: 305 492 499 (08:30 - 10:15)

-Conveners: 刘 荣; 陈 金根

time	[id]	title	presenter
08:30	[10]	Back-n 2019-2020年度裂变截面和全截面测量总体情况介绍	永浩, 陈
08:45	[11]	Th-232裂变截面测量实验进展	智洲, 任
09:02	[12]	Pu239裂变截面测量初步结果	长林, 兰
09:19	[13]	铍全截面实验进展	江博, 白
09:36	[14]	Li-7全截面测量及初步实验数据处理	继峰, 胡
09:53	[15]	合作讨论	